

Unión Particular para la Clasificación Internacional de Patentes (Unión de la CIP) Grupo de Trabajo sobre la Revisión de la CIP

**Quincuagésima segunda reunión
Ginebra, 14 a 18 de octubre de 2024**

INFORME

aprobado por el Grupo de Trabajo

INTRODUCCIÓN

1. El Grupo de Trabajo sobre la Revisión de la CIP celebró su quincuagésima segunda reunión en Ginebra del 14 al 18 de octubre de 2024. Los siguientes miembros del Grupo de Trabajo estuvieron representados en la reunión: Alemania, Arabia Saudita, Australia, Brasil, Bulgaria, Canadá, China, Egipto, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Irlanda, Israel, Japón, México, Noruega, Países Bajos (Reino de los), Reino Unido, República Checa, República de Corea, República de Moldova, Rumania, Suecia, Suiza, Ucrania, Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO), Oficina Europea de Patentes (OEP) (30). Hungría estuvo representada en calidad de observadora. La lista de participantes figura en el Anexo I del presente informe.

2. La reunión fue inaugurada por el Sr. K. Natsume, subdirector general del Sector de Infraestructura y Plataformas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), quien dio la bienvenida a los participantes.

MESA

3. La Sra. A. Merle-Gamez (OEP) fue elegida presidenta y la Sra. N. Beauchemin (Canadá) vicepresidenta para el ciclo de revisión de la CIP de 2024-2025.

4. La Sra. N. Xu (OMPI) ejerció las funciones de secretaria de la reunión.

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

5. El Grupo de Trabajo aprobó por unanimidad el orden del día revisado, que figura como Anexo II del presente informe.

DEBATE, CONCLUSIONES Y DECISIONES

6. Con arreglo a lo decidido por los órganos rectores de la OMPI en su décima serie de reuniones, celebrada del 24 de septiembre al 2 de octubre de 1979 (párrafos 51 y 52 del documento AB/X/32), en el informe de la presente reunión se recogen únicamente las conclusiones del Grupo de Trabajo (decisiones, recomendaciones, opiniones, etc.) pero no se recogen, en particular, las declaraciones formuladas por los participantes, excepto en los casos en que se haya expresado una reserva en relación con determinada conclusión del Grupo de Trabajo o se haya repetido una reserva tras alcanzar dicha conclusión.

INFORME DE LA VIGESIMOSÉPTIMA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 1 DE LAS OFICINAS IP5 - GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA CLASIFICACIÓN

7. El Grupo de Trabajo tomó nota de un informe oral de la KIPO, en nombre de las cinco Oficinas de la Cooperación Pentalateral (Oficinas IP5), sobre la vigesimoséptima reunión del Grupo de Trabajo de las Oficinas IP5 sobre la Clasificación.

8. Las Oficinas IP5 acordaron promover cinco proyectos IP5 (proyectos F) a la fase de la CIP, a saber, los proyectos F 194, F 195, F 200, F 203 y F 205, donde el proyecto F 194 pertenecía a las áreas candidatas a la hoja de ruta para la revisión de la CIP.

9. Se señaló que la KIPO, en nombre de las Oficinas IP5, había publicado en el foro electrónico de la CIP, en el proyecto [CE 456](#), las listas actualizadas de todos los proyectos y propuestas en curso de las IP5 (véase el Anexo 48 del expediente del proyecto) para evitar solapamientos entre las peticiones de revisión y las actividades de revisión en curso.

INFORME DEL GRUPO DE ESPECIALISTAS EN TECNOLOGÍAS DE SEMICONDUCTORES (EGST)

10. El Grupo de Trabajo tomó nota de un informe oral de la OEP, la oficina principal del EGST.

11. El Grupo de Trabajo tomó nota de que la undécima reunión del EGST (EGST/2024/11) tuvo lugar en Ginebra del 9 al 11 de octubre de 2024.

12. Se informó al Grupo de Trabajo de que había sido una reunión muy intensa y extraordinariamente productiva, en la que se habían ultimado los esquemas para las subclases H10P y H10W, las dos últimas subclases de la clase H10, que habían sido aprobadas por el EGST y presentadas al Grupo de Trabajo para su aprobación. También se debatieron en profundidad las cuestiones de los proyectos [C 514](#), [C 515](#) y [C 516](#) en curso, relativos a las subclases H10D, H10F y H10H.

13. También se señaló que el EGST había acordado una hoja de ruta [CE 481](#) actualizada (v3.3), que figura en el anexo 505 del proyecto [CE 481](#), en el que se esperaba que los proyectos [C 517](#) y [C 518](#) relativos a las subclases H10P y H10W estuvieran terminados con respecto a los esquemas y definiciones para finales de mayo de 2025, con vistas a la CIP 2026.01.

14. El Grupo de Trabajo expresó su sincero agradecimiento a todos los miembros del EGST y, en particular, a la OEP, oficina principal del EGST, por los considerables resultados obtenidos hasta la fecha.

PROGRAMA DE REVISIÓN DE LA CIP

15. El Grupo de Trabajo examinó 35 proyectos de revisión, a saber: [C 510](#), [C 514](#), [C 515](#), [C 516](#), [C 517](#), [C 518](#), [C 519](#), [C 525](#), [C 529](#), [C 530](#), [C 531](#), [C 532](#), [C 533](#), [C 534](#), [C 535](#), [C 536](#), [C 537](#), [C 538](#), [C 539](#), [C 540](#), [F 140](#), [F 148](#), [F 170](#), [F 175](#), [F 177](#), [F 180](#), [F 184](#), [F 185](#), [F 186](#), [F 188](#), [F 189](#), [F 190](#), [F 191](#), [F 196](#) y [F 198](#).

16. El Grupo de Trabajo aprobó 16 proyectos de revisión, uno de los cuales se completó con la confirmación de que no era necesaria ninguna definición, a saber, el proyecto [F 191](#), cuyas modificaciones del esquema entrarían en vigor en la CIP 2026.01, mientras que cinco de los 16 se aprobaron con respecto a modificaciones del esquema en las versiones inglesa y francesa, a saber, los proyectos [C 532](#), [C 533](#), [F 140](#), [F 180](#) y [F 189](#), que entrarían en vigor en la CIP 2026.01. Entretanto, diez de los 16 proyectos se completaron con respecto a las definiciones, que se integrarían en la CIP 2025.01, a saber, los proyectos [C 510](#), [C 514](#), [C 515](#), [C 516](#), [C 525](#), [F 170](#), [F 175](#), [F 177](#), [F 184](#) y [F 188](#), mientras que sus modificaciones de esquema habían sido completadas por el Grupo de Trabajo en reuniones anteriores.

17. El Grupo de Trabajo aprobó además (o aprobó parcialmente / provisionalmente) nueve proyectos de revisión con respecto a la versión inglesa de las modificaciones del esquema, a saber, los proyectos [C 517](#), [C 518](#), [C 529](#), [C 536](#), [C 538](#), [F 148](#), [F 190](#), [F 196](#) y [F 198](#).

18. En el foro electrónico, dentro de los correspondientes proyectos, se indica la situación de los proyectos mencionados, junto con la lista de las medidas futuras y los plazos. Todas las decisiones, observaciones y anexos técnicos están disponibles en los anexos denominados "Decisión del Grupo de Trabajo" de los proyectos correspondientes que figuran en el foro.

19. El Grupo de Trabajo acordó crear dos nuevos proyectos de revisión, a saber:

Química: [C 541](#) (ponente: Alemania), procedente del proyecto [C 534](#); y

[C 542](#) (ponente: República de Corea), procedente del proyecto [M 627](#).

20. El Grupo de Trabajo acordó crear un nuevo proyecto de definición, a saber:

Mecánica: [D 313](#) (ponente: Estados Unidos de América), procedente del proyecto [F 170](#).

21. El Grupo de Trabajo, una vez más, recomendó encarecidamente que las oficinas ponentes, las oficinas traductoras y las oficinas que realicen comentarios utilicen los "documentos de trabajo" o los "anexos técnicos preparatorios", elaborados por la Oficina Internacional, si los hubiera, a la hora de presentar propuestas y comentarios durante los debates del foro electrónico de la CIP.

MANTENIMIENTO DE LA CIP

22. El Grupo de Trabajo debatió 14 proyectos de mantenimiento, a saber: [M 000](#), [M 621](#), [M 627](#), [M 633](#), [M 634](#), [M 812](#), [M 831](#), [M 835](#), [M 836](#), [M 837](#), [M 838](#), [M 839](#), [M 840](#) y [M 841](#).

23. El Grupo de Trabajo aprobó 12 proyectos de mantenimiento; las modificaciones del esquema y de la definición de uno de ellos se integrarían en la CIP 2025.01, a petición especial del Grupo de Trabajo, a saber, el proyecto [M 837](#), mientras que se completaron cuatro proyectos con respecto a las modificaciones del esquema y de la definición, cuando estaban disponibles, que se integrarían en la CIP 2026.01, a saber, los proyectos [M 831](#), [M 835](#), [M 840](#) y [M 841](#). Entretanto, el Grupo de Trabajo aprobó las modificaciones de esquema y definición resultantes de múltiples propuestas, cuyas modificaciones de esquema se incluirían en la CIP 2026.01, mientras que las modificaciones de definición se integrarían en la CIP 2025.01, a saber, los proyectos [M 627](#) y [M 633](#). Los otros dos proyectos de mantenimiento se aprobaron

sin ninguna repercusión inmediata en el esquema y las definiciones, a saber, el proyecto [M 000](#), con una plantilla actualizada para la supresión de las referencias no limitativas del esquema, y el proyecto [M 812](#), que se completó. El Grupo de Trabajo también tomó nota de las modificaciones de las definiciones que se integrarían en la CIP 2025.01 tras su aprobación electrónica en los proyectos [M 621](#), [M 631](#) y [M 634](#).

24. En el foro electrónico, dentro de los correspondientes proyectos, se indica la situación de los proyectos mencionados, junto con la lista de las medidas futuras y los plazos. Todas las decisiones, observaciones y anexos técnicos están disponibles en los anexos denominados “Decisión del Grupo de Trabajo” de los proyectos correspondientes que figuran en el foro.

25. El Grupo de Trabajo acordó crear dos nuevos proyectos de mantenimiento, a saber:

T-independiente: [M 842](#) (ponente: OEP), procedente del proyecto [M 831](#); y

[M 843](#) (ponente: Estados Unidos de América), procedente del proyecto [F 148](#).

SITUACIÓN DE LA SUPRESIÓN DE LAS REFERENCIAS NO LIMITATIVAS DE LOS PROYECTOS M 200 A M 500

26. El debate se basó en un informe de situación elaborado por la Oficina Internacional sobre los proyectos de mantenimiento para la supresión de las referencias no limitativas del esquema de la CIP (anexo 52 del expediente del proyecto [WG 191](#)).

27. El Grupo de Trabajo tomó nota de que, entre los 17 proyectos activos, se había llegado o se llegaría pronto a un acuerdo sobre los cuatro proyectos siguientes durante los debates mantenidos en el foro electrónico y que estos proyectos podían considerarse finalizados. Las modificaciones correspondientes del esquema y las definiciones se incluirían por consiguiente en la CIP 2026.01.

[M 282](#) Supresión de las referencias no limitativas en la subclase A24D (ponente: Brasil)

[M 287](#) Supresión de las referencias no limitativas en la subclase A46B (ponente: Israel)

[M 288](#) Supresión de las referencias no limitativas en la subclase A46D (ponente: Israel)

[M 289](#) Supresión de las referencias no limitativas en la subclase G06D (ponente: OEP)

28. Se informó al Grupo de Trabajo de que los demás 13 proyectos deberían continuar sus debates en el foro electrónico de la CIP.

29. El Grupo de Trabajo invitó a las oficinas a utilizar la plantilla actualizada para la eliminación de las referencias no limitativas del esquema del Anexo 4 en el marco del proyecto [M 000](#), que acaba de aprobarse en esta reunión.

30. El Grupo de Trabajo alentó a las oficinas a asumir activamente la tarea de eliminar las referencias no limitativas del esquema, en vista de que hay que ocuparse de más de 200 subclases pendientes. Las oficinas voluntarias deberán informar a la Oficina Internacional sobre las subclases que prefieren seleccionando en el cuadro actualizado del expediente del proyecto [WG 191](#) y posteriormente la Oficina Internacional creará los proyectos M 200 a M 500 en el foro electrónico de la CIP con esas oficinas como ponentes.

31. La Secretaría indicó que en el expediente del proyecto [WG 191](#) se publicará un cuadro actualizado en el que se resume la situación de la supresión de las referencias no limitativas del esquema.

PRÓXIMA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO

32. Tras evaluar el volumen de trabajo previsto para su siguiente reunión, el Grupo de Trabajo convino en dedicar los dos primeros días al ámbito de la electricidad, el siguiente día al ámbito de la química y los dos últimos días al ámbito de la mecánica.

33. El Grupo de Trabajo tomó nota de las siguientes fechas provisionales para su quincuagésima tercera reunión:

12 a 16 de mayo de 2025

CLAUSURA DE LA REUNIÓN

34. La presidenta clausuró la reunión.

35. *El presente informe fue aprobado por unanimidad por el Grupo de Trabajo por medios electrónicos el 4 de noviembre de 2024.*

[Siguen los Anexos]

LISTE DES PARTICIPANTS/

LIST OF PARTICIPANTS

I. ÉTATS MEMBRES/MEMBER STATES

(dans l'ordre alphabétique des noms français des États)
(in alphabetical order of the names in French)

ALLEMAGNE/GERMANY

Oliver STEINKELLNER (Mr.), Head, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

Stefanie GABRIEL (Ms.), Deputy Head, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

Martina FRITZSCHE-HENKE (Ms.), Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office, Munich

Mark KAMINSKI (Mr.), Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

Steffen MÜNCH (Mr.), Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

Peter SCHULLER (Mr.), Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

Florian SIEBEL (Mr.), Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

Veronika TINKL (Ms.), Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA

Namazi ALI (Mr.), Patent Expert, Patents, Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP), Riyadh

Fahad ALNAFJAN (Mr.) Patent Expert, Patents, Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP), Riyadh

Rawabi ALMUHIMED (Ms.), Patents, Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP), Riyadh

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Thanh NGUYEN (Ms.), Examiner/Classifier, IP Australia, Phillip

BRÉSIL/BRAZIL

CATIA VALDMAN (Ms.), Head, Documentation Division, Classification Group, Secretary National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Development, Industry, Commerce and Services (MDIC), Rio de Janeiro

Darcio GOMES PEREIRA (Mr.), National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Development, Industry, Commerce and Services (MDIC), Campinas

Anderson BALTAZAR (Mr.), Researcher, National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Development, Industry, Commerce and Services (MDIC), Niterói-Rio de Janeiro

BULGARIE/BULGARIA

Radoslava MLADENOVA (Ms.), Patent Examiner, Examination and Protection of Inventions, Utility Models and Industrial Designs, Patent Office of the Republic of Bulgaria, Sofia

CANADA

Nancy BEAUCHEMIN (Mme), gestionnaire de programme - International, Direction des brevets, Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), Innovation, Sciences et Développement Économique Canada (ISDE), Gatineau

CHINE/CHINA

DONG Yan (Ms.), Program Officer, Patent Documentation Department, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing

GE Huilin (Ms.), Section Head, Mechanical Examination Division, Patent Examination Cooperation Center (PECC) Guangdong, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Guangzhou

LIU Haiyan (Ms.), Section Head, China Patent Technology Development Corporation, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing

LIU Mengyao (Ms.), Examiner, Patent Examination Cooperation Center (PECC) Beijing, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing

ÉGYPTE/EGYPT

Heba ABOUMOHAMED (Ms.), Senior Pharmaceutical Patent Examiner, Patent Technical Examination, Egyptian Patent Office, Academy of Scientific Research and Technology (ASRT), Ministry of Scientific Research, Cairo

Marwa HOSNY (Ms.), Senior Pharmaceutical Patent Examiner, Patent Technical Examination, Egyptian Patent Office, Academy of Scientific Research and Technology (ASRT), Ministry of Scientific Research, Cairo

ESPAGNE/SPAIN

León MENA (Sr.), Examinador de Patentes, Departamento de Patentes y Tecnología de la Información, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Madrid

Otón FERNÁNDEZ (Sr.), Examinador de Patentes, Departamento de Patentes y Tecnología de la Información, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Madrid

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Anita COUPE (Ms.), Acting Chief Patent Classification Official, Classification and Standards Development, Office of International Patent Cooperation, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Donald TARAZANO (Mr.), Director, Classification and Standards Development, Office of International Patent Cooperation, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

JILL GRAY (Ms.), Supervisory Patent Classifier, Chemical, Classification Standards and Development, Office of International Patent Cooperation, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Chris JETTON (Mr.), Patent Classifier, Classification Standards and Development, Office of International Patent Cooperation, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Catherine KUHLMAN (Ms.), Patent Classifier, Project Coordinator, Classification Standards and Development, Office of International Patent Cooperation, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Cathy LAM (Ms.), Patent Classifier, Classification Standards and Development, Office of International Patent Cooperation, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Gustavo LOPEZ (Mr.), Patent Classifier, Classification Standards and Development, Office of International Patent Cooperation, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Ekaterina PAVLOVA (Ms.), Senior Specialist, Multilateral Cooperation Division, International Cooperation Department, Federal Service for Intellectual Property (Rospatent), Moscow

Fyodor SARATOVSKIY (Mr.), Researcher, IPC Section, Federal Service for Intellectual Property (Rospatent), Moscow

Nataliya ALISOVA (Ms.), IPC Section, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property (Rospatent), Moscow

Lada TSIKUNOVA (Ms.), IPC Section, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property (Rospatent), Moscow

Andrey SHPIKALOV (Mr.), IPC Section, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property (Rospatent), Moscow

Zoya VOYTSEKHOVSKAYA (Ms.), IPC Section, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property (Rospatent), Moscow

FINLANDE/FINLAND

Hanna AHO (Ms.), Head of Division, Patents and Trademarks/Mechanical and Civil Engineering, Finnish Patent and Registration Office (PRH), Ministry of Economic Affairs and Employment, Helsinki

FRANCE

Magalie MATHON (Mme), chargée de mission CIB, Département des brevets, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie

David DURIEZ (M.), ingénieur examinateur, Département des brevets, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie

Géraldine VENTORUZZO (Mme), experte en électricité, Département des brevets, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie

IRLANDE/IRELAND

Fergal BRADY (Mr.), Examiner of Patents, Patent Examination, Intellectual Property Office of Ireland (IPOI), Department of Enterprise, Trade and Employment, Kilkenny

ISRAËL/ISRAEL

Orit REGEV (Ms.), Deputy Superintendent of Examiners, Israel Patent Office, Ministry of Justice, Jerusalem

JAPON/JAPAN

KIKUCHI Yoichi (Mr.), Director, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

TAKAKUSAKI Ayane (Ms.), Assistant Director, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

INAGAKI Akihiko (Mr.), Deputy Director, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

YAMADA Yuka (Ms.), Administrative Officer, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

HODOZUKA Haruka (Ms.), Classification Project Coordinator, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

ISHIZAKA Tomoki (Mr.), Classification Project Coordinator, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

KUDO Yuki (Ms.), Classification Project Coordinator, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

NISHIZUKA Yuto (Mr.), Classification Project Coordinator, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

SAKAI Shuichi (Mr.), Classification Project Coordinator, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

SASAKI Takashi (Mr.), Classification Project Coordinator, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

SHIMIZU Hirokatsu (Mr.), Classification Project Coordinator, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

MATSUMURA Mari (Ms.), Classification Project Coordinator, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

MEXIQUE/MEXICO

Pedro Christian AYALA ROSALES (Sr.), Especialista en Propiedad Industrial, Dirección Divisional de Relaciones Internacionales, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México

Rita Jacqueline BRAVO CORIA (Sra.), Especialista en Propiedad Industrial, Dirección Divisional de Patentes, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México

Ayari FERNANDEZ SANTA CRUZ (Sra.), Especialista en Propiedad Industrial, Dirección Divisional de Patentes, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México

Miguel GONZALEZ AGUILAR (Sr.), Especialista en Propiedad Industrial, Dirección Divisional de Patentes, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México

Alicia MARMOLEJO FLORES (Sra.), Especialista en Propiedad Industrial, Dirección Divisional de Patentes, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México

Pablo ZENTENO MARQUEZ (Sr.), Especialista en Propiedad Industrial, Dirección Divisional de Patentes, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México

Itzel FERNÁNDEZ PANDO (Sra.), Asesor, Propiedad Intelectual, Misión Permanente, Ginebra

NORVÈGE/NORWAY

Bente AARUM-ULVÅS (Ms.), Chief Examiner, Process and Industry, Patent, Norwegian Industrial Property Office (NIPO), Oslo

PAYS-BAS (ROYAUME DES)/NETHERLANDS (KINGDOM OF THE)

Mark PETERS (Mr.), Examiner, Netherlands Patent Office, Ministry of Economic Affairs and Climate Policy, The Hague

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

KOH Wonkyou (Mr.), Deputy Director, Patent Examination Policy Coordination Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

SHIN Heesang (Mr.), Deputy Director, Patent Examination Policy Coordination Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

SHIN Jieun (Ms.), Assistant Deputy Director, Patent Examination Policy Coordination Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

JUNG Byungte (Mr.), Head, IP Classification Division, Korea Institute of Intellectual Property Promotion (KIPRO), Daejeon

JEONG Jieun (Ms.), Team Leader, IPC Revision Team, IP Classification Division, Korea Institute of Intellectual Property Promotion (KIPRO), Daejeon

CHA Hyunsoo (Mr.), Senior Classification Expert, IPC Revision Team, IP Classification Division, Korea Institute of Intellectual Property Promotion (KIPRO), Daejeon

YOON Inseok (Mr.), Classification Expert, IPC Revision Team, IP Classification Division, Korea Institute of Intellectual Property Promotion (KIPRO), Daejeon

JO Jinseo (Ms.), Classification Expert, IPC Revision Team, IP Classification Division, Korea Institute of Intellectual Property Promotion (KIPRO), Daejeon

KIM Youngji (Ms.), Classification Expert, IPC Revision Team, IP Classification Division, Korea Institute of Intellectual Property Promotion (KIPRO), Daejeon

KIM Joohyeok (Mr.), Classification Expert, IPC Revision Team, IP Classification Division, Korea Institute of Intellectual Property Promotion (KIPRO), Daejeon

LEE Jaeheon (Mr.), Classification Expert, IPC Revision Team, IP Classification Division, Korea Institute of Intellectual Property Promotion (KIPRO), Daejeon

GWAK Jieun (Ms.), Classification Expert, IPC Revision Team, IP Classification Division, Korea Institute of Intellectual Property Promotion (KIPRO), Daejeon

WON Sanghyuk (Mr.), Classification Expert, IPC Revision Team, IP Classification Division, Korea Institute of Intellectual Property Promotion (KIPRO), Daejeon

NOH Jinkwang (Mr.), Classification Expert, IPC Revision Team, IP Classification Division, Korea Institute of Intellectual Property Promotion (KIPRO), Daejeon

LEE Jinyong (Mr.), Counsellor/IP Attaché, Economy/Intellectual Property, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA

Natalia CAISIM (Ms.), Head, Examination Division, Patents, State Agency on Intellectual Property (AGEPI), Chisinau

Svetlana LEVITCHI (Ms.), Principal Consultant, Examination Division, Patents, State Agency on Intellectual Property of the Republic of Moldova (AGEPI), Chisinau

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Jarmila AVRATOVA (Ms.), Engineer, Patent Information, Industrial Property Office of the Czech Republic, Prague

ROUMANIE/ROMANIA

Luiza Emanuela MODREANU (Ms.), Patent Examiner, Inventions Department, Romanian State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest

Octavian-Alexandru NICOLEANU (Mr.), Patent Examiner - Mechanical, Patent Department, Romanian State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Jeremy COWEN (Mr.), Senior Patent Examiner, Patent Examining Division, Intellectual Property Office (UK IPO), Newport

Patrick PURCELL (Mr.), Senior Patent Examiner, Patent Examining Division Intellectual Property Office (UK IPO), Newport

Huw THOMAS (Mr.), Senior Patent Examiner, Patent Examining Division, Intellectual Property Office (UK IPO), Newport

Rhys WILLIAMS (Mr.), Senior Patent Examiner, Patent Examining Division, Intellectual Property Office (UK IPO), Newport

SERBIE/SERBIA

Zorica PETROVIC (Ms.), Patent Examiner, Patent Sector, Intellectual Property Office of the Republic of Serbia, Belgrade

SUÈDE/SWEDEN

Anders BRUUN (Mr.), Patent Expert, Patent Division, Swedish Intellectual Property Office (PRV), Stockholm

Moa EMLING (Ms.), Senior Examiner, Chemistry, Patent Division, Swedish Intellectual Property Office (PRV), Stockholm

Tomas LUND (Mr.), Senior Patent Examiner, Patent Division, Swedish Intellectual Property Office (PRV), Stockholm

SUISSE/SWITZERLAND

Pascal WEIBEL (M.), chef Examen, Division des brevets, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Département fédéral de justice et police (DFJP), Berne

Lauriane ANGUÉ (Mme), expert en brevet, Division des brevets, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Département fédéral de justice et police (DFJP), Berne

Philippe TATASCIORE (M.), expert en brevet, Division des brevets, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Département fédéral de justice et police (DFJP), Berne

UKRAINE

Viktorii GRYSHCHENKO (Ms.), Head, Department of Information and Documentary Support, State Organization “Ukrainian National Office for Intellectual Property and Innovations (UANIPPO)”, Kyiv

Dmytro PROKOPENKO (Mr.), Intellectual Property Professional, Unit for Work with International Classifications, State Organization “Ukrainian National Office for Intellectual Property and Innovations (UANIPPO)”, Kyiv

Anastasii RYKOVSKA (Ms.), Leading Expert, Unit of Quality Control and Improvement of Examination of Applications, State Organization “Ukrainian National Office for Intellectual Property and Innovations (UANIPPO)”, Kyiv

Volodymyr RYSAK (Mr.), Head, Unit for Bilateral Cooperation in the Field of Intellectual Property, State Organization “Ukrainian National Office for Intellectual Property and Innovations (UANIPPO)”, Kyiv

II. ÉTAT OBSERVATEUR/OBSERVER STATE

HONGRIE/HUNGARY

Ildikó DIÓSPATONYI (Ms.), Patent Examiner, Pharmaceuticals and Agriculture Section, Hungarian Intellectual Property Office (HIPO), Budapest

III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT ORGANISATION (EPO)

Roberto IASEVOLI (Mr.), Head Classification Board, The Hague

Massimo CRESCENTI (Mr.), Classification Board, The Hague

Silvia GENNARI (Ms.), Classification Board, Munich

Michael MAY (Mr.), Classification Board, Munich

Agnès MERLE GAMEZ (Ms.), Classification Board, The Hague

Norbert WIENOLD (Mr.), Classification Board, Munich

Nathalie GEISLER (Ms.), Classification Board, The Hague

Mark PLEHIERS (Mr.), Classification Board, The Hague

Erik TORLE (Mr.), Classification Board, Munich

Rossana VINCI (Ms.), Classification Board, The Hague

Peter SWARÉN (Mr.), Classification Board, The Hague

Jérôme CARRÉ (Mr.), Classification Board, Munich

Ciro PERNICE (Mr.), Classification Board, The Hague

ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)

Ahmed IBRAHIM (Mr.), Senior Patent Examiner, Intellectual Property Directorate, Harare

IV. BUREAU/OFFICERS

présidente/Chair: Agnès MERLE GAMEZ (Mme/Ms.) (OEB)/(EPO)

vice-présidente/
Vice Chair Nancy BEAUCHEMIN (Mme/Ms.) (CANADA)

secrétaire/
Secretary:) XU Ning (Mme/Ms.) (OMPI/WIPO)

V. BUREAU INTERNATIONAL DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Ken-Ichiro NATSUME (M./Mr.), sous-directeur général du Secteur de de l'infrastructure et des plateformes/Assistant Director General, Infrastructure and Platforms Sector

Kunihiko FUSHIMI (M./Mr.), directeur de la Division des classifications internationales et des normes, Secteur de de l'infrastructure et des plateformes/Director, International Classifications and Standards Division, Infrastructure and Platforms Sector

XU Ning (Mme/Ms.), chef de la Section de la classification internationale des brevets (CIB), Division des classifications internationales et des normes, Secteur de de l'infrastructure et des plateformes/Head, International Patent Classification (IPC) Section, International Classifications and Standards Division, Infrastructure and Platforms Sector

Rastislav MARČOK (M./Mr.), administrateur principal de la classification des brevets de la Section de la classification internationale des brevets (CIB), Division des classifications internationales et des normes, Secteur de de l'infrastructure et des plateformes/Senior Patent Classification Officer, International Patent Classification (IPC) Section, International Classifications and Standards Division, Infrastructure and Platforms Sector

Isabelle MALANGA SALAZAR (Mme/Ms.), assistante à l'information de la Section de la classification internationale des brevets (CIB), Division des classifications internationales et des normes, Secteur de de l'infrastructure et des plateformes/Information Assistant, International Patent Classification (IPC) Section, International Classifications and Standards Division, Infrastructure and Platforms Sector

Caroline SCHLESSINGER (Mme/Ms.), secrétaire II de la Division des classifications internationales et des normes, Secteur de de l'infrastructure et des plateformes/Secretary II, International Classifications and Standards Division, Infrastructure and Platforms Sector

[Sigue el Anexo II]

ORDEN DEL DÍA

1. Apertura de la sesión
2. Elección de la presidencia y una vicepresidencia
3. Aprobación del orden del día
4. Informe de la vigesimoséptima reunión del Grupo de Trabajo 1 de las Oficinas IP5 - Grupo de Trabajo sobre la Clasificación
Informe oral de la KIPO en nombre de las Oficinas de la Cooperación Pentalateral.
5. Informe del Grupo de Expertos en Tecnología de Semiconductores (EGST)
Véase el proyecto [CE 481](#).
6. Proyectos de revisión de la CIP relativos al ámbito de la mecánica
Véanse los proyectos [C 536](#), [C 538](#), [F 148](#), [F 170](#), [F 175](#), [F 184](#), [F 185](#), [F 186](#), [F 188](#) y [F 191](#).
7. Proyectos de revisión de la CIP relativos al ámbito de la electricidad
Véanse los proyectos [C 510](#), [C 514](#), [C 515](#), [C 516](#), [C 517](#), [C 518](#), [C 519](#), [C 530](#), [C 532](#), [C 533](#), [C 537](#), [C 539](#), [C 540](#), [F 140](#), [F 177](#), [F 189](#), [F 190](#), [F 196](#) y [F 198](#).
8. Proyectos de revisión de la CIP relativos al ámbito de la química
Véanse los proyectos [C 525](#), [C 529](#), [C 531](#), [C 534](#), [C 535](#) y [F 180](#).
9. Proyectos de mantenimiento de la CIP relativos al ámbito de la mecánica
Véanse los proyectos [M 000](#), [M 621](#), [M 634](#), [M 831](#) y [M 841](#).
10. Proyectos de mantenimiento de la CIP relativos al ámbito de la electricidad
Véanse los proyectos [M 633](#), [M 836](#), [M 837](#), [M 838](#), [M 839](#) y [M 840](#).
11. Proyectos de mantenimiento de la CIP relativos al ámbito de la química
Véanse los proyectos [M 627](#), [M 812](#) y [M 835](#).
12. Situación de la supresión de referencias no limitativas de los proyectos M 200 a M 500
Véase el proyecto [WG 191](#).
13. Próxima reunión del Grupo de Trabajo
14. Clausura de la reunión
15. Aprobación del informe

[Fin del Anexo II y del documento]